

光谱对焦测厚系统

双光谱相比单向测量精度更高

适用全部材质 · 测量精准稳定 · 全套应用方案

产品优势：

- ◆ 稳定量测各类材质,例如金属/陶瓷/镜面/玻璃等
- ◆ 无接触快捷测量厚度,产品放置实时输出测量结果
- ◆ 稳定性强,高温高压等严苛操作条件下亦能正常使用
- ◆ 根据产品大小及精度要求更换不同测头,易整合于各行业测量应用

产品参数：

型号	SFS-D8022	SFS-D8055
单边工作距离	22mm	55mm
对射测厚量程	1mm	1.5mm
精度	1μm	5μm
采样频率	200~2000 Point/sec	
电源/功耗	24V DC2A	
工作温度	5~40°	

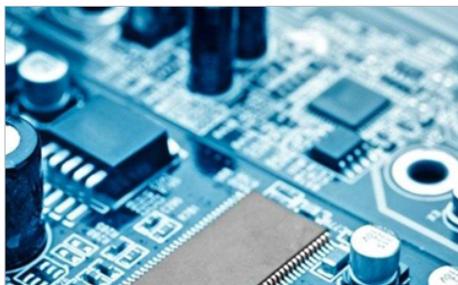
应用领域：

- ◆ 手机, 平板, 电脑等金属机壳机加制造业
- ◆ PCB板, 连接器, IC芯片等电子业
- ◆ 面板, 玻璃, 钢化膜等行业
- ◆ 半导体晶圆, 绿能, 光伏等行业

产品案例：



手机行业



电子行业



医疗行业



半导体行业

